

TOF-SIMSによる歯科インプラントの分析

Tiの酸化・水素化の深さ方向の状態評価が可能

測定法 : TOF-SIMS

製品分野 : 医療機器・医薬品

分析目的 : 組成評価・同定・組成分布評価

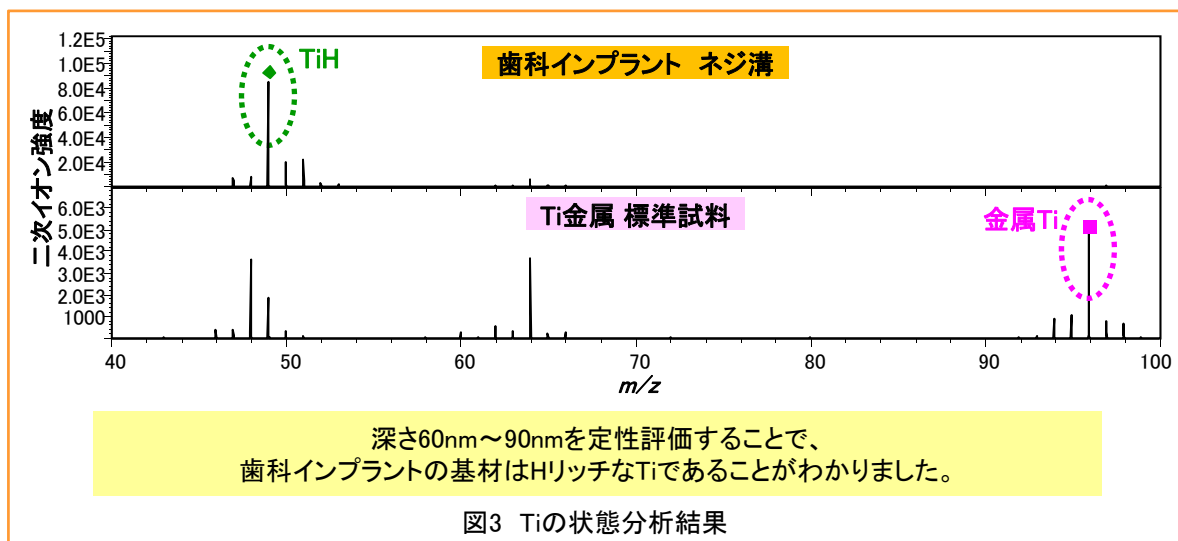
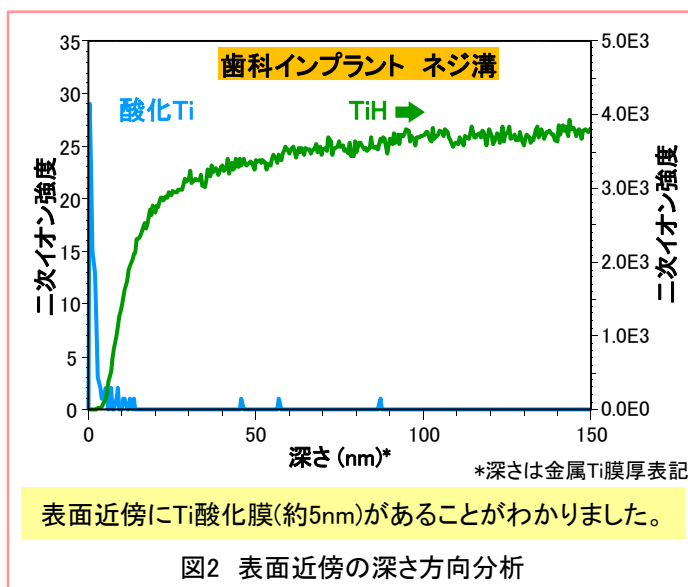
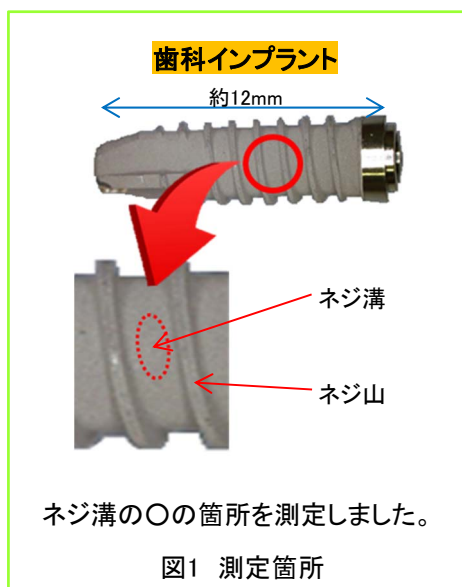
概要

歯科インプラントとは、虫歯や歯周病などにより歯を失った場合に顎の骨に埋め込む人工的な器具です。生体に埋め込むため、生体組織と直接触れる表面部の状態評価が重要です。

TOF-SIMSは最表面の定性分析に加え、最表面での深さ方向分解能に優れ、高感度に深さ方向の状態評価を行うことが可能です^(*)。

本事例では、歯科インプラントのTiの状態を深さ方向に評価した結果をまとめております。

データ



^{*}分子情報の深さ方向分析の参考出典: Harumi Masudome et al., Surf.Interface Anal. 2011, 43, 664-668

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート!